

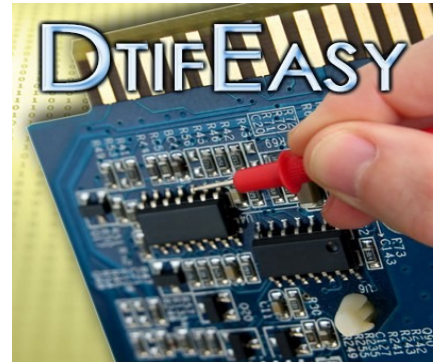
MARVIN TEST SOLUTIONS

DtifEasy Series

LASAR ポストプロセッサ、ランタイムおよび診断テスト・ソリューション

LASAR POST PROCESSOR, RUN TIME AND DIAGNOSTIC TEST SOLUTION

- LASAR シミュレーションで生成された IEEE-1445 準拠の .tap ファイルを取り込み、変換、実行
- MTS のデジタルハードウェアおよびデジタル・ファンクションテストシステムで使用可能
- GX5960 および GX5292 デジタル計測器をサポート
- go / no-go、フォールトディクショナリ、ガイドッドプローブ機能をフルサポート
- テストエグゼクティブ GUI を備えた ATEasy/Windows アプリケーションにより開発と展開を簡素化



概要 (DESCRIPTION)

DtifEasy は、LASAR シミュレーションで生成された IEEE-1445 準拠のデジタル・テストベクタを取り込み、変換し、実行するためのフル機能のツールセットです。IEEE-1445 の 4 つのファイルタイプ (UUT モデルグループ、スティミュラス／レスポンスグループ、フォールトディクショナリグループ、プローブグループ) すべてに DtifEasy が対応し、go/no-go、フォールトディクショナリ、ガイドッドプローブの各シーケンスを実行できます。DtifEasy は、MTS の 3U PXI GX529x シリーズ (200 MHz まで) のダイナミック・デジタル計測器、および 6U PXI の GX5960 (50 MHz) デジタル計測器をサポートします。これらの計測器ファミリはいずれもデジタル・ロジックプローブに対応しています。

.tap ファイルの変換処理、UUT の構成、go/no-go およびプローブシーケンスの実行に関する全体的な制御と実行は、DtifEasy 製品に含まれる ATEasy テスト開発／実行環境が提供します。また、プログラミング上の要件に応じて、ATEasy のみでアプリケーションを開発することも、CVI、LabVIEW、C、C++、VB などの他のプログラミング言語から go/no-go およびプローブシーケンスを制御・実行することもできます。

DtifEasy の変換ツールは、MTS のデジタル計測器／システムと組み合わせることで、LASAR ベースの既存アプリケーション (.tap ファイル) をレガシー・プラットフォームから新しいテストプラットフォームへ移行するユーザーに、低コストかつ優れたソリューションを提供します。同様に、LASAR (別売) を用いて UUT を再シミュレーションすることで、より低コストな PXI ベースのデジタル・ファンクションテスト・プラットフォームへ UUT を再ホストする、費用対効果の高い手段が得られます。

DtifEasy は、IEEE-1445 のすべてのファイルタイプを変換し、MTS のデジタル計測器およびガイドッドプローブで実行できます。取り込んだ .tap ファイル、ガイドッドプローブ用情報 (UUT の画像を含めることも可能)、デジタル・サブシステム構成、UUT アダプタのピンマッピングはすべて XML ファイル形式で定義され、アプリケーションのテスト情報を統一かつ容易に保存・管理できます。

ガイドッドプローブは、デジタルプローブ、モーメンタリ式プッシュボタン、ステータス・インジケータで構成されます。プローブは GX529x および GX5960 デジタル計測器に対応し、ガイドッドプローブ・シーケンスに対してプロービングした UUT の状態を提供します。ガイドッドプローブ・アルゴリズムは「スタックアット」故障を検出し、ノードの再プロービングに対応するほか、部品／ノードのプロービングをスキップできるため、UUT の診断全体を高速化します。オプションとして UUT の画像を組み込むことができ、プロービング時にプローブ位置をグラフィカルに示す補助ツールとして利用できます。

特長 (FEATURES)

その他の機能として、テスト、プローブ、フォールトディクショナリの結果をテキストまたは HTML 形式でログ出力できます。イベント・プログラミングにも対応しており、プローブイベントやシーケンスの前後で UUT の初期化や制御を行います。また DtifEasy の変換ツールは UUT の入力ピンと出力ピンを結合できるため、テストの I/O リソースを節約し、より

少ないチャネル数のシステムを実現します。これは、入力専用と出力専用のデジタル・テストチャネルに依存していたレガシー・テストプログラムを変換する場合に特に有効です。

アプリケーション (APPLICATIONS)

- DTS-70、L200、L300、Spectrum 9100、GR179x、GR2750、GR2225、S790 などのレガシー・テストシステムで運用されているデジタル・テストアプリケーションの変換／再ホスト
- PXI ベースのテストプラットフォームへの LASAR ベース・アプリケーションの展開

仕様 (SPECIFICATIONS)

DTIFEASY - LASAR ポストプロセッサ、ランタイムおよび診断テスト・ソリューション (DTIFEASY - LASAR POST PROCESSOR, RUN TIME AND DIAGNOSTIC TEST SOLUTION)	
互換性 (Compatibility)	IEEE Standard 1445-1998 (R2004), Digital Test Interchange Format (DTIF)
対応ファイルグループ (Supported File Groups)	UUT モデル・グループ、ストリムラス／レスポンス・グループ、フォルト・ディクショナリ・グループ、プローブ・グループ
対応デジタル・テストハードウェア (Supported Digital Test Hardware)	GX5960、6U PXI、32 チャンネルおよび 16 チャンネルの計測器 GX529x、3U PXI、32 チャンネルのデジタル計測器
デジタル・テストモード (Digital Test Modes)	go / no-go、フォルト・ディクショナリ、ガイドド・プローブ
テストおよびプローブログのデータファイル形式 (Test and Probe Log Data File Formats)	Text and HTML
対応デジタルチャンネル数の最大値 (Maximum Number of Digital Channels Supported)	512
デジタルプローブ (Digital Probe)	ステータス・インジケータとプッシュボタンを内蔵したロジック・プローブ。デジタル・チャンネルを 3 本使用します。

対応テストシステム (COMPATIBLE TEST SYSTEMS)	
TS-730	構成済みのミックスド・シグナル・テスト・プラットフォーム。最大 96 本のダイナミック・デジタル・チャンネル、ユーザー電源、アナログのストリムラス／測定リソースを搭載します。
TS-750	構成済みのデジタル・テスト・プラットフォーム。最大 128 本のダイナミック・デジタル・チャンネル、ユーザー電源、DMM、スタティック・デジタル・リソースを搭載します。
TS-775	構成済みの軍用アビオニクス・テスト・プラットフォーム。最大 96 本のダイナミック・デジタル・チャンネル、ユーザー電源、DMM、1553 インタフェース、スタティック・デジタル・リソースを搭載します。

対応デジタル計測器 (COMPATIBLE DIGITAL INSTRUMENTS)	
GX529x Series	GX5292: 3U PXI、100 MHz、32 チャンネルのダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごと、ベクタごとのドライブ／センス制御。 GX5293: 3U PXI、200 MHz、16 チャンネルのダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごと、ベクタごとのドライブ／センス制御。 GX5295: 3U PXI、100 MHz、32 チャンネルのダイナミック・デジタル計測器。プログラマブル・ピンエレクトロニクスとピンごとの PMU を搭載。
GX5960	6U PXI、50 MHz、32 チャンネルのダイナミック・デジタル・サブシステム。チャンネルごとに -14 V ～ +26 V のプログラマブルなドライバ／センサ、256 タイムセット、エッジ分解能 1 ns。

LASAR は Teradyne, Inc. の商標です。／注: 仕様は予告なく変更される場合があります。

オーダー情報 (ORDERING INFORMATION)

オーダー情報 (ORDERING INFORMATION)

DtifEasy	LASAR ポストプロセッサ、開発、ランタイムおよび診断テスト・ソリューション
DtifEasy-RT	LASAR ポストプロセッサ・ランタイムおよび診断テスト・ソリューション

トレーニング (TRAINING)

DtifEasy-DS	Marvin Test Solutions（カリフォルニア州アーバイン）で実施する 4 日間の DtifEasy トレーニング（ATEasy を含む）、1 ～ 3 名。それ以上の人数はお問い合わせください。
DtifEasy-DS2	オンサイトで実施する 4 日間の DtifEasy トレーニング（ATEasy を含む）セミナー、1 ～ 3 名。それ以上の人数はお問い合わせください。

お問い合わせ (CONTACT)

本製品に関するご質問、お見積り、デモンストレーションのご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください。

アンドールシステムサポート株式会社 (ANDOR SYSTEM SUPPORT CO., LTD.)

部署	自動テストソリューション事業部
所在地	〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 66-2 興和川崎西口ビル 8 階
TEL	044-201-7844（代表）
E-mail	marvintest@andor.jp
Web	https://www.andor.jp/
お問い合わせ	https://www.andor.jp/company/contact/

本書は Marvin Test Solutions, Inc. の英文データシート（Revision B • Updated Nov 5, 2021）を日本語に翻訳した参考資料です。仕様は予告なく変更される場合があります。正式な仕様は英文原本を参照してください。

Copyright © Marvin Test Solutions, Inc. All rights reserved. 記載の製品名および社名は各社の商標です。